

赵玉珍 北京 中国科学院物理研究所 100080

吕佩德 北京 中国科学院物理研究所 100080

摘要: 本文报道了用具有二维电荷注入检测器(CID)和端视等离子体炬的全谱直读等离子体光谱仪,同时测定Al-Mg-Ge-Si合金中Al-Mg-Ge-Si的方法。试样用HNO₃-HF溶解后,加H₃BO₃络合过量的F,并用其中的B为内标进行测定,以改善测量的精密度与准确度。合成试样的回收率为99.1%~101.0%,样品测定的相对标准偏差小于1%。方法简便、准确,用于样品分析,结果满意。

关键词:

文章全文为PDF格式,请下载 to 本机浏览。 [[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器,请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

100080

100080

Abstract:

Key words:

【大 中 小】 [[关闭窗口](#)]